

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

KARTA PRZEDMIOTU

obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Kierunek studiów: Fizyka Techniczna

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod kierunku: FT

Stopień studiów: II

Specjalności: Nowoczesne materiały i nanotechnologie

1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

NAZWA PRZEDMIOTU	Fizyka powierzchni i cienkich warstw
NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU ANGIELSKIM	
KOD PRZEDMIOTU	WIMiF FT oIIS D2 19/20
KATEGORIA PRZEDMIOTU	Przedmioty specjalnościowe
LICZBA PUNKTÓW ECTS	5.00
SEMESTRY	1

2 RODZAJ ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW

SEMESTR	WYKŁAD	ĆWICZENIA	LABORATORIUM	LABORATORIUM KOMPUTERO- WE	SEMINARIUM	PROJEKT
1	30	0	0	0	0	30

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Zapoznanie studentów z pojęciem cienkiej warstwy i znaczeniem cienkich warstw w elektronice.

Cel 2 Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania cienkich warstw

Cel 3 Zapoznanie studentów z procesami i etapami wzrostu cienkich warstw

Cel 4 Zapoznanie studentów z metodami badania morfologii i struktury cienkich warstw

Cel 5 Zapoznanie studentów z różnorodnymi właściwościami cienkich warstw

Cel 6 Zapoznanie studentów z różnorodnymi zastosowaniami cienkich warstw, w tym warstw organicznych

Cel 7 Nabycie umiejętności charakteryzowania cienkich warstw poprzez opanowanie metod wizualizacji różnorodnych danych, ich analizy i modelowania cienkich warstw w oparciu o odpowiednie programy graficzne i obliczeniowe.

4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1 zaliczenie podstawowego kursu fizyki.

5 EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK1 Wiedza Student wyjaśnia istotę pojęcia cienkiej warstwy i znaczenia warstw w elektronice

EK2 Wiedza Student opisuje metody różnorodne otrzymywania cienkich warstw

EK3 Wiedza Student opisuje procesy i etapy wzrostu cienkich warstw

EK4 Wiedza Student opisuje metody badania morfologii i struktury cienkich warstw

EK5 Wiedza Student opisuje różnorodne właściwości cienkich warstw

EK6 Wiedza Student opisuje różnorodne zastosowania cienkich warstw, w tym warstw organicznych

EK7 Umiejętności Student potrafi przygotować projekt dotyczący wizualizacji danych doświadczalnych, analizy tych danych i modelowania wybranych właściwości cienkich warstw

6 TREŚCI PROGRAMOWE

PROJEKT		
LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
P1	Projekt zespołowy: Wprowadzanie danych i sporządzanie wykresów w programie graficzno-obliczeniowym ORIGIN; import i eksport danych.	4
P2	Projekt zespołowy: Digitalizacja danych w postaci wykresów.	2
P3	Projekt zespołowy: Interpolacja danych.	2
P4	Projekt zespołowy: Dopasowanie funkcji liniowej do różnych danych doświadczalnych dla cienkich warstw w programie ORIGIN.	4
P5	Projekt zespołowy: Użycie funkcji wbudowanych w ORIGIN do dopasowania nieliniowego do różnych danych doświadczalnych dla cienkich warstw.	4
P6	Projekt zespołowy: Zaimplementowanie własnych funkcji do dopasowania nieliniowego i przeprowadzenie procedury dopasowania do różnych danych doświadczalnych dla cienkich warstw	8

PROJEKT		
LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
P7	Projekt indywidualny: Zaimplementowanie własnej funkcji do dopasowania nieliniowego i przeprowadzenie procedury dopasowania do wybranych danych doświadczalnych dla cienkich warstw	6

WYKŁAD		
LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
W1	Wstęp; definicja cienkiej warstwy, znaczenie cienkich warstw w elektronice	4
W2	Metody otrzymywania cienkich warstw; parowanie termiczne stadia procesu, znaczenie niskiego ciśnienia, zjawiska adsorpcji i kondensacji, metody parowania; epitaksja z wiązek molekularnych. Rozpylanie katodowe, metody chemiczne, w tym chemiczne osadzanie z par i metody elektrochemiczne.	4
W3	Proces i etapy wzrostu cienkich warstw; zarodkowanie i wzrost zarodków, tworzenie się wysp, wzrost i koalescencja wysp, tworzenie się warstwy ciągłej. Rola podłoża w procesie powstawania cienkiej warstwy	4
W4	Morfologia i struktura cienkich warstw; warstwy krystaliczne i amorficzne. Metody rentgenowskie, funkcja rozkładu radialnego. Dyfrakcja elektronów i mikroskopia elektronowa; rodzaje mikroskopów elektronowych (transmisyjny, odbiciowy, skaningowy). Efekt tunelowy; skaningowy mikroskop tunelowy. Mikroskopia sił atomowych.	6
W5	Właściwości cienkich warstw; właściwości mechaniczne (napreżenia w cienkich warstwach, zależność odkształcenia od napreżenia, adhezja cienkich warstw do podłoża), elektryczne (oporność cienkich warstw i jej zależność od temperatury, rozpraszanie elektronów w cienkiej warstwie) optyczne (zjawiska odbicia, załamania i absorpcji, elipsometria, przejścia optyczne w półprzewodnikach krystalicznych i amorficznych), właściwości magnetyczne.	6
W6	Zastosowania cienkich warstw; zastosowania optyczne, zastosowania w elektronice - elementy bierne i czynne, zastosowania w optoelektronice; warstwy tlenkowe jako materiały na przezroczyste elektrody. Cienkie warstwy organiczne; materiały molekularne i polimerowe; organiczne diody świecące (OLED) i organiczne ogniwa słoneczne.	6

7 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

N1 Wykłady

N2 Prezentacje multimedialne

N3 Ćwiczenia projektowe

N4 Konsultacje

8 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI	ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:	
Godziny wynikające z planu studiów	60
Konsultacje przedmiotowe	0
Egzaminy i zaliczenia w sesji	0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:	
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury	30
Opracowanie wyników	30
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji	30
SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJĄCA Z CAŁEGO NAKŁADU PRACY STUDENTA	150
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU	5.00

9 SPOSOBY OCENY

OCENA FORMUJĄCA

F1 Test

F2 Projekt indywidualny

OCENA PODSUMOWUJĄCA

P1 Średnia ważona ocen formujących

KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTAŁCENIA 1	
NA OCENĘ 2.0	Student nie zna definicji cienkiej warstwy.
NA OCENĘ 3.0	Student zna definicje cienkiej warstwy.
NA OCENĘ 3.5	Student zna definicje cienkiej warstwy i w miarę potrafi opisać znaczenie cienkich warstw w elektronice.
NA OCENĘ 4.0	Student zna definicje cienkiej warstwy i dobrze potrafi opisać znaczenie cienkich warstw w elektronice.
NA OCENĘ 4.5	Student zna definicje cienkiej warstwy i potrafi opisać znaczenie cienkich warstw w elektronice i podać ponad 1-2 przykłady.

NA OCENĘ 5.0	Student zna definicje cienkiej warstwy i potrafi opisać znaczenie cienkich warstw w elektronice i podać ponad 2 przykłady.
EFEKT KSZTAŁCENIA 2	
NA OCENĘ 2.0	Student nie potrafi podać żadnego sposobu otrzymywania cienkich warstw.
NA OCENĘ 3.0	Student potrafi podać przynajmniej jeden sposób otrzymywania cienkich warstw
NA OCENĘ 3.5	Student potrafi podać 2 sposoby otrzymywania cienkich warstw.
NA OCENĘ 4.0	Student potrafi podać 3 sposoby otrzymywania cienkich warstw.
NA OCENĘ 4.5	Student potrafi podać 4 sposoby otrzymywania cienkich warstw.
NA OCENĘ 5.0	Student potrafi podać 5 lub więcej sposobów otrzymywania cienkich warstw.
EFEKT KSZTAŁCENIA 3	
NA OCENĘ 2.0	Student nie wie nic na temat procesu wzrostu cienkich warstw.
NA OCENĘ 3.0	Student zna przynajmniej jeden z etapów wzrostu cienkich warstw.
NA OCENĘ 3.5	Student zna 2 etapy wzrostu cienkich warstw.
NA OCENĘ 4.0	Student zna 3 etapy wzrostu cienkich warstw.
NA OCENĘ 4.5	Student zna 4 etapy wzrostu cienkich warstw.
NA OCENĘ 5.0	Student zna 4 lub więcej etapów wzrostu cienkich warstw i zna rolę podłoża w procesie powstawania cienkiej warstwy.
EFEKT KSZTAŁCENIA 4	
NA OCENĘ 2.0	Student nie wie nic na temat struktury cienkich warstw.
NA OCENĘ 3.0	Student zna różnice między warstwami krystalicznymi i amorficznymi.
NA OCENĘ 3.5	Student zna różnice między warstwami krystalicznymi i amorficznymi i zna jedną z metod badania cienkich warstw.
NA OCENĘ 4.0	Student zna różnice między warstwami krystalicznymi i amorficznymi i zna 2 metody badania cienkich warstw.
NA OCENĘ 4.5	Student zna różnice między warstwami krystalicznymi i amorficznymi i zna 3 metody badania cienkich warstw.
NA OCENĘ 5.0	Student zna różnice między warstwami krystalicznymi i amorficznymi i zna 4 lub więcej metod badania cienkich warstw.
EFEKT KSZTAŁCENIA 5	
NA OCENĘ 2.0	Student nie wie nic nt. właściwości cienkich warstw.
NA OCENĘ 3.0	Student opisuje przynajmniej jeden rodzaj właściwości cienkich warstw, spośród właściwości mechanicznych, elektrycznych, optycznych i magnetycznych.

NA OCENĘ 3.5	Student opisuje 2 rodzaje właściwości cienkich warstw.
NA OCENĘ 4.0	Student opisuje 3 rodzaje właściwości cienkich warstw.
NA OCENĘ 4.5	Student opisuje 4 rodzaje właściwości cienkich warstw.
NA OCENĘ 5.0	Student opisuje 5 lub więcej rodzajów właściwości cienkich warstw.
EFEKT KSZTAŁCENIA 6	
NA OCENĘ 2.0	Student nie potrafi podać ani jednego przykładu zastosowania cienkich warstw.
NA OCENĘ 3.0	Student potrafi podać przynajmniej jeden przykład zastosowania cienkich warstw.
NA OCENĘ 3.5	Student potrafi podać 2 przykłady zastosowania cienkich warstw.
NA OCENĘ 4.0	Student potrafi podać 3 przykłady zastosowania cienkich warstw.
NA OCENĘ 4.5	Student potrafi podać 4 przykłady zastosowania cienkich warstw.
NA OCENĘ 5.0	Student potrafi podać 4 lub więcej przykładów zastosowania cienkich warstw, w tym warstw organicznych.
EFEKT KSZTAŁCENIA 7	
NA OCENĘ 2.0	Student nie potrafi przygotować projektu nt. jednej z wybranych właściwości cienkich warstw.
NA OCENĘ 3.0	Student potrafi przygotować prosty projekt nt. jednej z wybranych właściwości cienkich warstw.
NA OCENĘ 3.5	Student potrafi przygotować projekt nt. jednej z wybranych właściwości cienkich warstw.
NA OCENĘ 4.0	Student potrafi przygotować interesujący projekt nt. jednej z wybranych właściwości cienkich warstw.
NA OCENĘ 4.5	Student potrafi przygotować bardzo interesujący projekt nt. jednej z wybranych właściwości cienkich warstw.
NA OCENĘ 5.0	Student potrafi przygotować bardzo interesujący projekt nt. jednej z wybranych właściwości cienkich warstw. Student potrafi przekonująco uzasadnić metodykę zastosowaną w swoim projekcie.

10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

EFEKT KSZTAŁCENIA	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW ZDEFINIOWANYCH DLA PROGRAMU	CELE PRZEDMIOTU	TREŚCI PROGRAMOWE	NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE	SPOSOBY OCENY
EK1		Cel 1	W1	N1 N2 N3 N4	F1 P1
EK2		Cel 2	W2	N1 N2 N3	F1 P1
EK3		Cel 3	W3	N1 N2 N3 N4	F1 P1
EK4		Cel 4	W4	N1 N2 N3 N4	F1 P1
EK5		Cel 5	W5	N1 N2 N3 N4	F1 P1
EK6		Cel 6	W6	N1 N2 N3 N4	F1 P1
EK7		Cel 7	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7	N1 N2 N3 N4	F1 P1

11 WYKAZ LITERATURY

LITERATURA PODSTAWOWA

- [1] | Eds. J.L. Vossen and W. Kern — *Thin Film Processes*, New York, 1978, Academic Press
- [2] | L. Eckertova — *Physics of Thin Films*, Prague, 1977, SNTL Publishers of Technical Literature

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- [1] | O.S. Heavens — *Thin Film Physics*, London, 1970, Methuen
- [2] | K.L. Chopra — *Thin Film Phenomena*, New York, 1969, McGraw-Hill Book Company
- [3] | E. Leja — *Otrzymywanie i właściwości elektryczne przezroczystych warstw tlenkowych typu SnO₂ i In₂O₃*, Kraków, 1982, Zeszyty nauk. AGH, nr 901, Mat.-Fiz.-Chem., zeszyt 55
- [4] | S. Ignatowicz, A. Kobendza — *Cienkie warstwy związków półprzewodnikowych AIBVI*, Warszawa, 1981, PWN
- [5] | Praca zb. pod red. W. Romanowskiego — *Cienkie warstwy metaliczne*, Warszawa, 1974, PWN

12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ

dr inż. Bożena Burtan-Gwizdała (kontakt: bburtan@pk.edu.pl)

OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT

- 1 dr inż. Bożena Burtan-Gwizdała (kontakt: bburtan@pk.edu.pl)
- 2 prof. dr hab. Jan Cisowski (kontakt: jcisowski@ifpk.pk.edu.pl)



13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

(miejsowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

PRZYJMUJĘ DO REALIZACJI (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

.....

.....